

Kongres Metrologii

Autor : Główny Urząd Miar

Od 19 do 22 czerwca w Kielcach i w Sandomierzu odbywał się VI Kongres Metrologii. Jest to cykliczna krajowa konferencja naukowa adresowana do wszystkich krajowych środowisk metrologicznych. Tegoroczny Kongres, który odbywał się pod hasłem „Metrologia królową badań stosowanych”, został zorganizowany przez Politechnikę Świętokrzyską oraz Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk. Kongresowi przewodniczył i patronował Rektor Politechniki Świętokrzyskiej, prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h. c. W obradach uczestniczył Przewodniczący Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. inż. Janusz Mrocza.

Główny Urząd Miar aktywnie uczestniczył w Kongresie Metrologii. Pracownicy Urzędu przedstawili dwanaście referatów, w tym na specjalnej sesji GUM i w trakcie dwóch wykładów plenarnych. W obradach uczestniczyło kierownictwo GUM, na czele z panią prezes Janiną Marią Popowską.

Poniżej tematy referatów, które przedstawili na kongresie pracownicy GUM. Treści referatów będą już wkrótce dostępne na stronie internetowej GUM.

1. Jerzy Borzymiński: Kierunki rozwoju terminologii metrologicznej w pracach Międzynarodowego Biura Miar i Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej
2. Albin Czubla: Precyzyjny światłowodowy transfer czasu i częstotliwości w relacji GUM-AOS (420 km)
3. Paweł Fotowicz: Historyczna droga kształtowania się teorii niepewności

pomiaru

4. Paweł Fotowicz: Współczesne podejście dotyczące wyrażania niepewności pomiaru

5. Paulina Kamińska: Zmiany w podejściu do prawnej kontroli metrologicznej

6. Robert Kordulasiński: Stanowiska pomiarowe do badania analizatorów wydechu

7. Elżbieta Michniewicz: Misja, rola i zadania Głównego Urzędu Miar, jako NMI, w świetle dokumentów międzynarodowych i krajowych

8. Zbigniew Ramotowski: Europejska współpraca metrologiczna w ramach programów EMRP i EMPIR – udział GUM w wybranych projektach

9. Patrycja Ruśkowska: Podstawowe jednostki miar a stałe fizyczne – rekomendacje XXIV. Generalnej Konferencji Miar

10. Grzegorz Sadkowski: Zaawansowane metody wzorcowania obciążeń przekładników

11. Piotr Sosinowski: Modernizacja przesuwu karetki pomiarowej na stanowisku komparatora interferencyjnego do wzorcowania wzorców kreskowych

12. Robert Szumski: Pomiary długich płytek wzorcowych na zmodernizowanym stanowisku pomiarowym z interferometrem laserowym





